Issue	Classification

Application/Control No. 10/517,618	Applicant(s)/Patent under Reexamination OHASHI ET AL.
Examiner	Art Unit
N Edwards	1774

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ISSUE	CL	AS	SIF	ICAT	ION								
ORIGINAL					Ī	INTERNATIONAL CLASSIFICATION											
	CLASS SUBCLASS						CI	AIMED					NON-CI	AIMED	-		
428 292.1		.1	B	04	Н		110	00					1				
CROSS REFERENCES							•						-				
CLASS SUBCLASS (ONE SUBCLASS PER BLOCK)									′					/			
428	116				B	32	B		2102						1		
					ļ	<u></u>				_					1		
				ļ <u>.</u>				•									
			ļ	ļ	ļ												
			L.,		<u></u>		ليا		_ /						1		
(Assi	None (Assistant Examiner) (Date) N. Edwards 1000																
50	College 1 19181			•							D.G. Claim(c)		O.G.			
degar ins	stuments	Examinen	(Date)	(Primary	Examir	ner)		(Date)			FILL	·	3)		Print Fig.		
<u> </u>		()-										1	-		No	one	
⊠ Claim	s renum	bered in th	e same or	der as pre	esent	ed by	appl	icant	C	PA		□т	.D.		☐ R.1.47		
Teuisino 1		31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	Final	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73		Final	91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103		Final	121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134		Final	151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164		Final	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193	
15	<u> </u>	45		75	-	 	105	 		135			165			194 195	
16	J [46		76			106] · [136	į		166			196	
17	┪╶┞	47 48	 	77	-		107 108	 		137 138			167 168			197 198	
19	<u> </u>	49		79			109	j .		139			169			199	
20		50		80			110	Į [140			170			200	
21	┨ ├	51 52	<u> </u>	81 82	 		111 112	{ }		141 142			171 172			201 202	
23] [53		83			113	j [143			173			203	
24	4	54	<u> </u>	84	F		114	[144			174			204	
25 26	┥┟	55 56	-	85 86	-		115 116	{ }		145 146			175 176			205 206	
27	1 [57		87			117	jĖ		147			177			207	
28	. [58		88	F		118] [148			178			208	
29 30	-{ -	59 60		89 90	-		119 120	 		149 150			179 180			209 210	
U.S. Retest and Trademot Office										100			1 100			210	